Història Corporativa i Desenvolupament d'Infraestructures

1975
Creació del Servei de Microscòpia Electrònica

1975
TEM Hitachi HU12A
Primer TEM de la UAB.
Voltatge d'acceleració de 75 kV.

1976
Obertura de portes

1982
SEM ISIS Super IIIA
Primer SEM de la UAB.

1986
SEM Hitachi S570
Millor resolució respecte equips anteriors.
Fotografia amb negatiu 6x7.

TEM Hitachi H-7000
Voltatge acceleració 125 kV.
Difracció d'electrons amb porta-mostres inclinable.

1994
SEM Jeol
Primer SEM amb imatge digital.
Incorporació de la tècnica EDX.

1996
Confocal Leica TCS 4D
Primer microscopi Confocal de la UAB.

2001
Servei de Microscòpia

2002
Confocal TCS SP2
Sistema espectral AOBS.

2003
Lupa Leica MZFIII
Incorpora llum transmesa, reflectida, fluorescència i polarització.

2004
TEM Jeol 2011
Primer TEM d'alta resolució de la UAB.
Voltatge d'acceleració 200 kV.
Observació de mostres en condicions criogèniques.

2005
TEM Jeol JEM-1400
Voltatge d'acceleració de 120 kV.

2006
Confocal Leica TCS SP5
Primer confocal totalment automatitzat.
Mòdul d'alta velocitat.
Mòdul de Multifotó.

2007
Confocal Olympus FV1000
Incorpora tècnica TIRFM.

2010
SEM ZEISS EVO MA10
Pressió variable.

SEM ZEISS Merlin
Primer SEM d'alta resolució de la UAB.
Filament d'emissió de camp.
Incorpora difracció d'electrons retro-dispersats (EBSD).

2020
Confocal ZEISS LSM 980
Primer confocal amb superresolució (Airyscan 2)
Mòdul de PicoQuant

2024
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

2024
Ultramicròtom Boeckler PowerTomePC
Ultramicròtom amb mòdul de crio.

2025
Escàner de portaobjectes Olympus SLIDEVIEW VS200
Incorpora camp clar, camp fosc, fluorescència i polarització.

Olympus IX85 – ScanR
Camp ampli automatitzat (CellSens).
Incorpora un sistema de cribratge d'alt contingut (ScanR).

1980 1990 2000 2010 2020

Elaborat per: Meritxell Vendrell Flotats